

## Contrastes en microscopie électronique : quels paramètres pour quelles images

**INSCRIPTIONS (GRATUITE MAIS OBLIGATOIRE) – date limite : 29 septembre 2017**

- **Pour les agents CNRS de la délégation Alpes (DR11) uniquement**, inscription en ligne : <https://cas.cnrs.fr/cas/login?service=https%3A%2F%2Fjanus.cnrs.fr%2Ffidp%2FAuthn%2FRemoteUser>  
Attention : l'application janus sera inaccessible du jeudi 29 juin 18h au vendredi 7 juillet
- **Pour tous les autres participants (autres délégations ou autres tutelles) :**  
Remplir la [fiche d'inscription](#) et l'adresser à [fp@dr11.cnrs.fr](mailto:fp@dr11.cnrs.fr)

### Programme :

- 9h00 - 9h30 Accueil des participants
- 9h30 - 10h00 Mot d'accueil de Anne Imberty (CERMAV), de Sylvain Cottaz (ICMG) et de France Simonet (RéCaMiA)
- 10h00 - 10h45 Quel contraste avec quel détecteur en MEB  
Frédéric Charlot - Grenoble
- 10h45 - 11h15 Le contraste à basse tension, inversion de contraste en MEB  
Jean-Jacques Dupuy - FEI
- 11h15 - 12h00 Le contraste en MET: EELS, HAADF, champ clair / champ sombre, HR  
Muriel Veron - Grenoble
- 12h00 - 13h30 *Déjeuner*
- 13h30 - 14h00 ECCI: Electron Channeling Contrast Imaging  
Nabila Maloufi - Metz
- 14h00 - 14h30 "phase plate", le contraste de la matière molle en MET  
Régis Ravelle-Chapuis - JEOL
- 14h30 - 15h00 Le contraste en cryo-MET  
Marc Schmutz - Strasbourg
- 15h00 - 15h30 *Pause*
- 15h30 - 16h00 Le contraste en WET-STEM  
Karine Masenelli-Varlot - Lyon
- 16h00 - 16h30 Les détecteurs in-lens  
Thierry Grenut - ELEXIENCE
- 16h30 - 17h00 Echanges, questions et clôture de la journée

